

1. Обзор литературы

Были изучены обзорные статьи [2, 1]. В них производится обзор рентгеновских дифракционных методов измерения параметров элементарной ячейки монокристаллов.

Список литературы

1. E Gałdecka. X-ray diffraction methods: single crystal. 2006.
2. В. В. Лидер. Прецизионное определение параметров кристаллической решётки. *Усп. физ. наук*, 190(9):971–994, 2020.